# 第7章 二极管

二极管的结构和工作原理

二极管应用电路的分析

# 7.1 二极管的结构和工作原理

# 7.1.1 本征半导体、掺杂半导体和PN结

# 一、本征半导体和本征激发

**导体**一一铁、铝、铜等金属元素等低价元素,其最外层电子在外电场作用下很容易产生定向移动,形成电流。

**绝缘体**一一惰性气体、橡胶等,其原子的最外层电子受原子核的束缚力很强,只有在外电场强到一定程度时才可能导电。

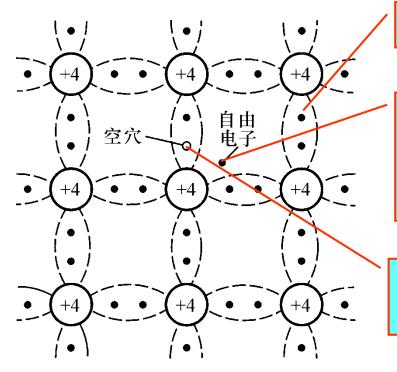
半导体一一硅(Si)、锗(Ge),均为四价元素,它们原子的最外层电子受原子核的束缚力介于导体与绝缘体之间。

本征半导体是纯净的晶体结构的半导体。

无杂质

稳定的结构

# 1、本征共价键结构



共价键

由于热运动,具有足够能量的价电子挣脱共价键的束缚,成为自由电子

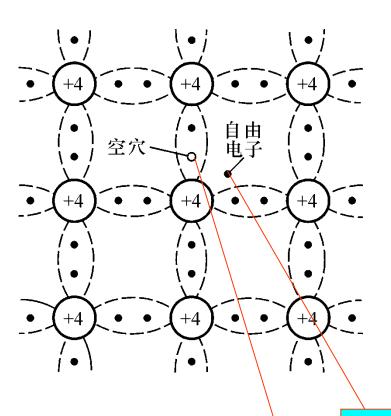
自由电子的产生使共价键中留有一 个空位置,称为**空穴** 

自由电子与空穴相碰同时消失, 称为复合。

动态平衡

一定温度下,自由电子与空穴对的<u>浓度一定</u>;温度升高,热运动加剧,挣脱共价键的电子增多,自由电子与空穴对的浓度加大。

# 2、本征半导体中的两种载流子



运载电荷的粒子称为载流子。

外加电场时,带负电的自由电子和 带正电的空穴均参与导电,且运动方向 相反。由于载流子数目很少,故导电性 很差。

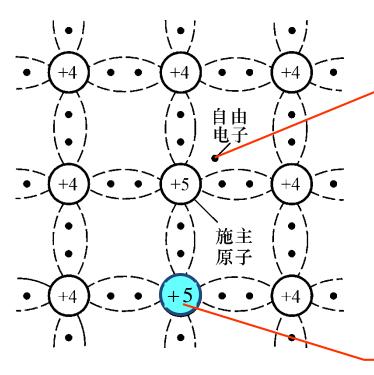
热力学温度OK时不导电。

温度升高,热运动加剧,载流子 浓度增大,导电性增强。

两种载流子

# 二、掺杂半导体

在本征半导体中,掺入一定量的杂质元素,就成为掺杂半导体。



#### 多数载流子

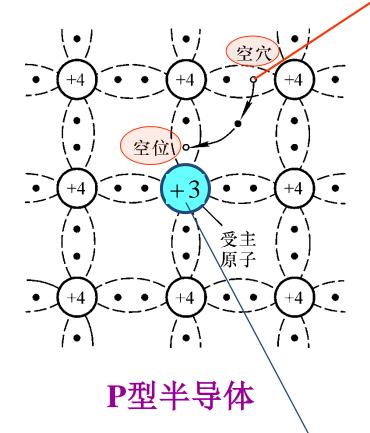
杂质半导体主要靠多数载流子 导电。掺入杂质越多,多子浓度越 高,导电性越强,实现导电性可控。

N型半导体

磷 (P)

(施主杂质)

#### 多数载流子



P型半导体主要靠空穴导电,掺入 杂质越多,空穴浓度越高,导电性越强,

在杂质半导体中,温度变化时

- ▶ 载流子的数目变化吗?
- ▶ 少子与多子变化的数目相同吗?

硼 (B)

(受主杂质)

# 1、载流子浓度

本征硅在热激发状态下, 电子数等于空穴数。

$$p = n = n_i \qquad n_i^2 = BT^3 e^{-EG/kT}$$

对于掺杂半导体,常温下多数载流子数近似为掺杂浓度,且满足:

N型半导体 
$$n_{n0}=N_D$$
  $p_{n0}=\frac{n_i^2}{N_D}$ 

P型半导体 
$$p_{p0}=N_A$$
  $n_{p0}=\frac{n_i^2}{N_A}$ 

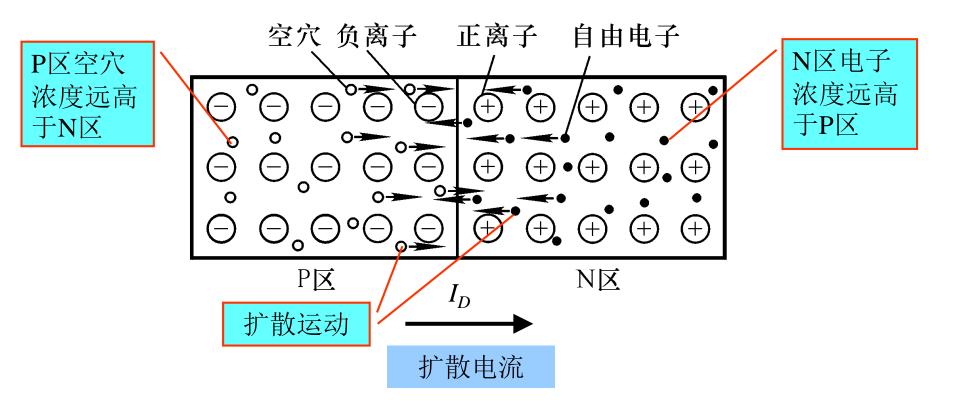
# 2、扩散和漂移

载流子在外电场作用下做定向移动,称为**漂移**(drift),由此形成的电流叫**漂移电流**。

载流子在浓度梯度的作用下做定向移动,称为<mark>扩散</mark>(diffusion), 由此形成的电流称为<mark>扩散电流</mark>。

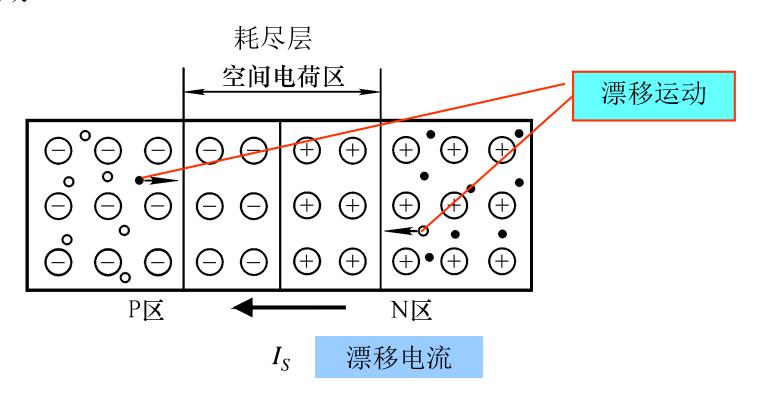
#### 三、PN结

#### 1、PN结的形成



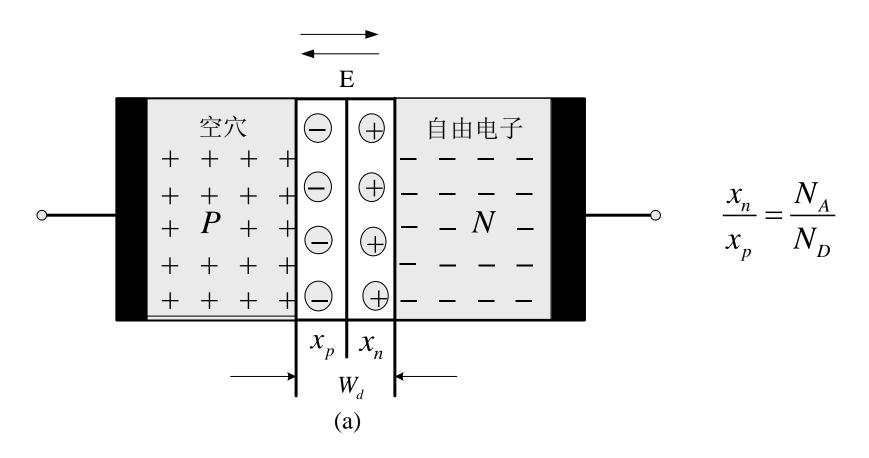
扩散运动使靠近接触面P区的空穴浓度降低、靠近接触面N区的自由电子浓度降低,产生内电场。

由于扩散运动使P区与N区的交界面缺少多数载流子,形成内电场,从 而阻止扩散运动的进行。内电场使空穴从N区向P区运动,自由电子从P区向 N 区运动。



参与扩散运动和漂移运动的载流子数目相同,达到动态平衡, 就形成了PN结。

# 2、耗尽层的宽度

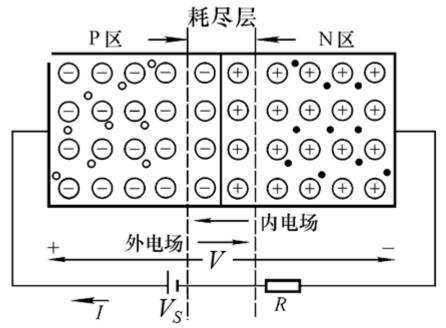


耗尽层任一边的宽度与该边掺杂浓度成反比。

# 3、反偏的PN结

# 

#### 4、正偏的PN结



#### PN结加反向电压截止:

耗尽层变宽,阻止扩散运动,有 利于漂移运动,形成漂移电流。由于 电流很小,故可近似认为其截止。

#### PN结加正向电压导通:

耗尽层变窄,扩散运动加剧,由于外电源的作用,形成扩散电流,PN结处于导通状态。

#### 5、PN 结的电容效应

# ①结电容

PN结外加电压变化时,空间电荷区的宽度将发生变化,有电荷的积累和释放的过程,与电容的充放电相同,其等效电容称为结电容 $C_i$ 。

# ②扩散电容

PN结外加的正向电压变化时,在扩散路程中载流子的浓度及其梯度均有变化,也有电荷的积累和释放的过程,其等效电容称为扩散电容 $C_d$ 。

# 6、PN 结的击穿

当PN结反向电压加大到一定程度时,将出现反向大电流,PN结发生击穿(Breakdown)。

# ① 雪崩击穿(Avalanche Multiplication)

发生在掺杂浓度较低的PN结中。耗尽层很厚,耗尽层内载流子与中性原子碰撞的机率很大。当反向电压增大到一定的数值时,载流子获得的动能足以把束缚在共价键中的价电子碰撞出来,产生新的电子—空穴对,反向电流急剧变大。雪崩击穿是不可逆的。

# ② 齐纳击穿(Zener Breakdown)

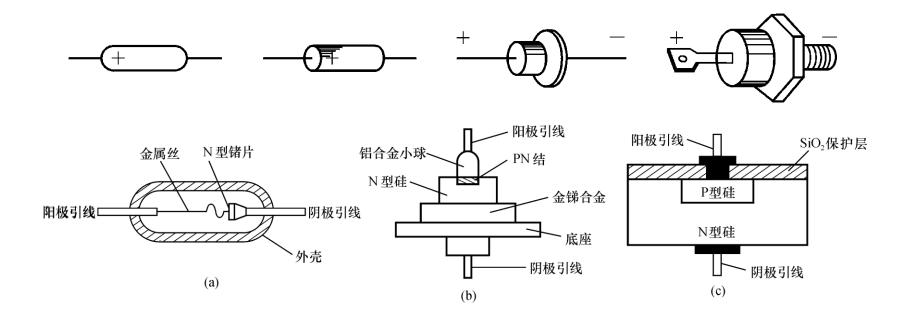
发生在掺杂浓度较高的PN结中。 耗尽层很薄, 耗尽层内载流子与中性原子碰撞的几率极小, 不易发生碰撞电离。反向电压不大时, 在耗尽层就能建立很强的电场, 足以把耗尽层内中性原子的价电子直接从共价键中拉出来, 产生新的自由电子—空穴对。齐纳击穿是可逆的。

# 7.1.2 二极管的结构及其伏安特性

# 一、二极管的结构

将PN结封装,引出两个电极,就构成了二极管。



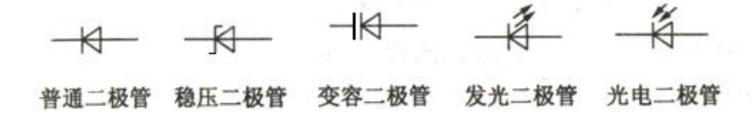


点接触型:结面积小,结电容小,允许通过的电流小,最高工作频率高。

面接触型:结面积大,结电容大,允许通过的电流大,最高工作频率低。

**平面型**:结面积可小、可大,小的工作频率高,大的允许通过的电流大。

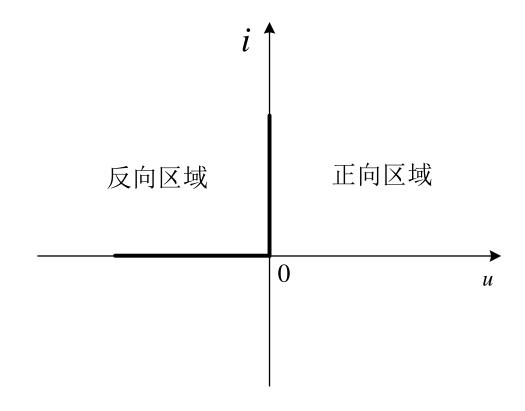
#### 二极管电路符号



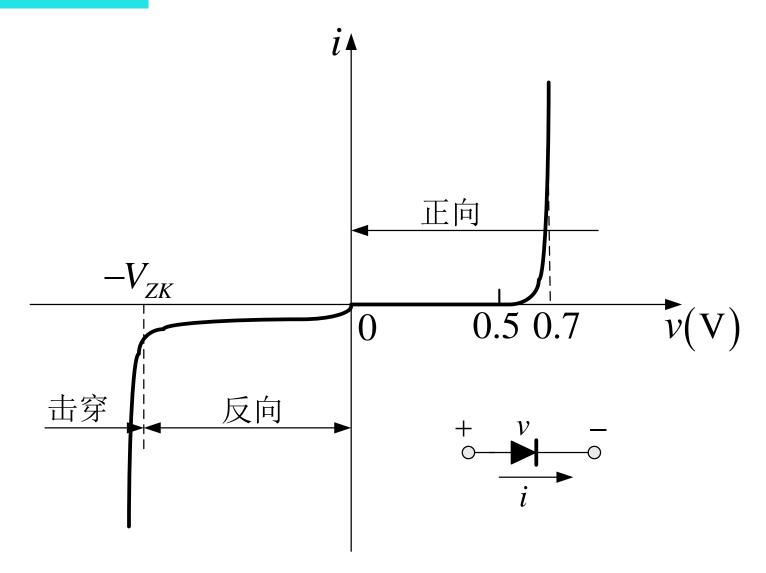
# 二、二极管伏安特性

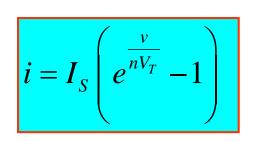
# 理想二极管

理想二极管的性能就像一个单向的开关,正向导通无压降,反向截止无漏电。



# 实际二极管

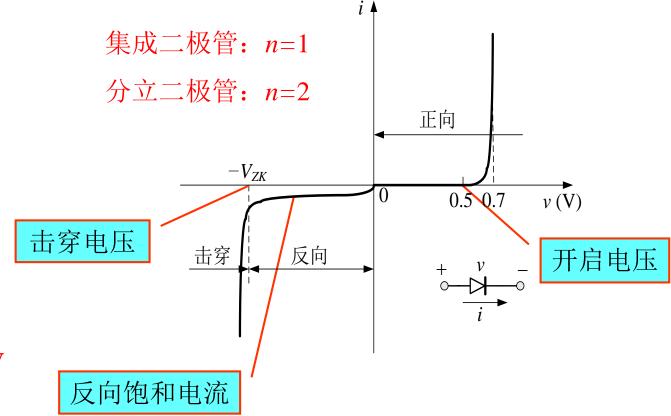




$$V_T = kT/q$$

#### 热电压:

室温下, $V_T \approx 25 \text{ mV}$ 



材料	开启电压	导通电压	反向饱和电流
硅Si	0.5V	0.5~0.8V	1μA以下
锗Ge	0.1V	0.1~0.3V	几十μA

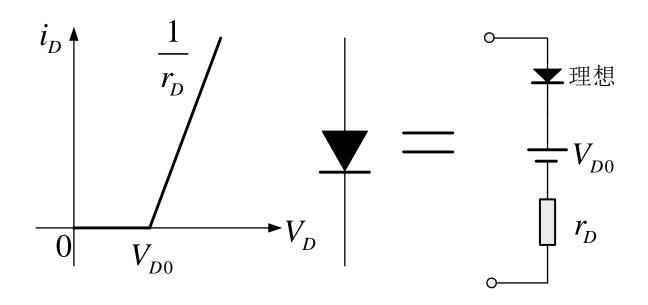
# 三、二极管的主要参数

- 最大整流电流  $I_F$ : 最大平均值
- $\bullet$  最大反向工作电压  $V_R$ : 最大瞬时值(反向击穿电压值的一半或三分之二)
- 反向饱和电流  $I_{s}$
- 最高工作频率 $f_M$ : 因PN结有电容效应

# 7.1.3 二极管电路模型

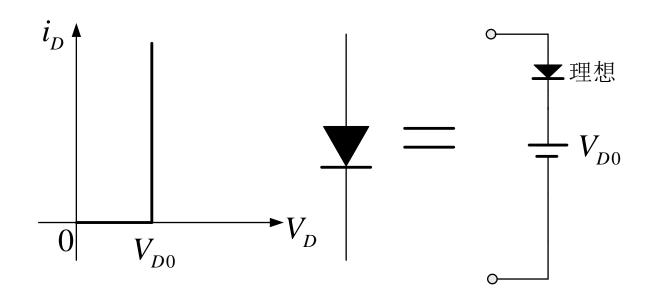
# 一、简化二极管模型

把一个普通的二极管等效为一个理想二极管、一个电压源和一个等效电阻的串联。



# 二、恒压降模型

把一个二极管等效成一个理想二极管和一个电压源的串联。



# 三、小信号模型

采用叠加原理分析二极管电路。

$$v_D = V_D + v_d(t)$$

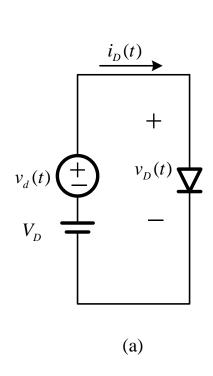
$$i_D(t) = I_S e^{(V_D + v_d)/nV_T} = I_S \cdot e^{V_D/nV_T} \cdot e^{v_d/nV_T} = I_D \cdot e^{v_d/nV_T}$$

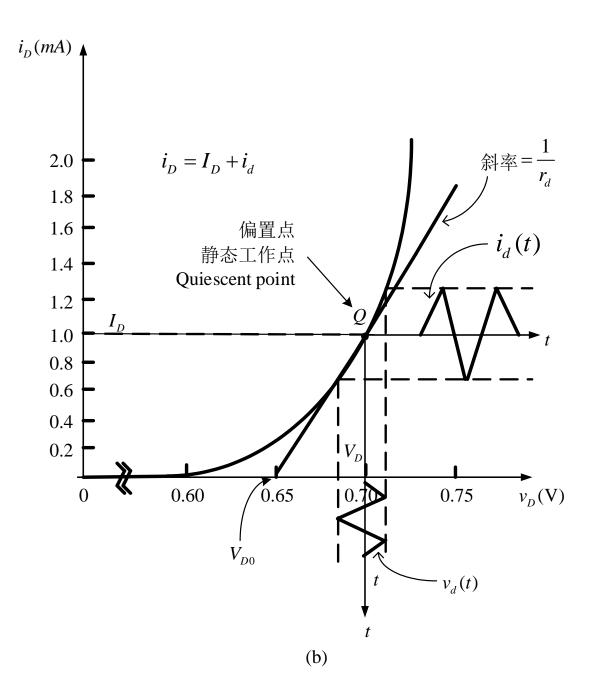
若
$$\frac{v_d}{nV_T}$$
<<1

$$i_D(t) \approx I_D \left( 1 + \frac{v_d}{nV_T} \right) = I_D + \frac{I_D}{nV_T} \cdot v_d = I_D + i_d$$

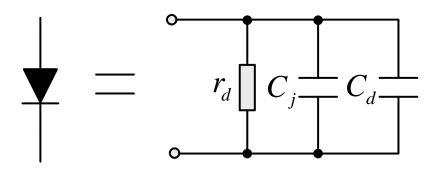
$$i_d = \frac{I_D}{nV_T} v_d = \frac{v_d}{r_d}$$

$$i_d = \frac{I_D}{nV_T} v_d = \frac{v_d}{r_d}$$
 
$$r_d = \frac{v_d}{i_d} = \frac{nV_T}{I_D}$$
 增量电阻





# 四、高频小信号模型



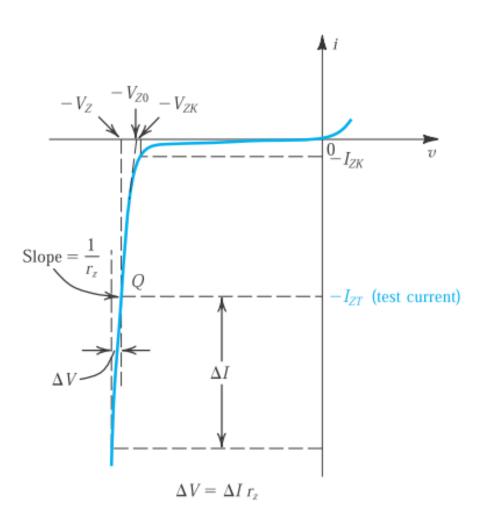
# 7.1.4 齐纳(或称稳压)二极管及其应用

# 一、工作原理

当击穿电压小于5 V时,通常是**齐纳效应**; 当击穿电压大于7 V时,通常是**雪崩效应**。 当击穿电压在5~7 V时,则两种情况兼而有之。



# 二、伏安特性



# 三、齐纳二极管的主要参数

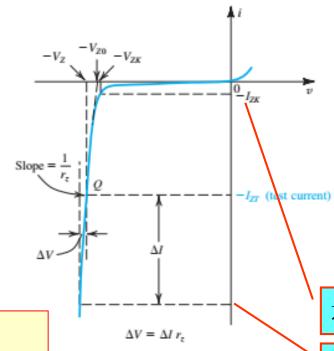
稳定电压 $V_Z$ 

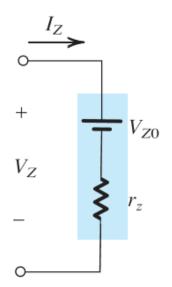
最大稳定电流  $I_{\text{max}}$ 

最小稳定电流  $I_{min}$ 

动态电阻  $r_z = \Delta V/\Delta I$ 

最大功耗  $P_{ZM} = I_{\text{max}} V_Z$ 





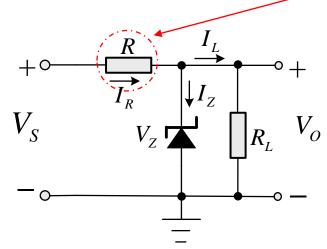
齐纳二极管等效模型

进入稳压区的最小电流

不至于损坏的最大电流

# 四、齐纳二极管的应用电路

若通过稳压管的电流太小则不能稳压,太大则会因功耗过大而损坏, 因而稳压管电路中必须有限制稳压管电流的<mark>限流电阻!</mark>



$$I_{\rm min} < I_Z < I_{\rm max}$$

$$I_{\min} < I_R - I_L < I_{\max}$$

$$I_{\min} < \frac{V_S - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_I} < I_{\max}$$

电源稳定度 
$$\frac{\Delta V_o}{\Delta V_s}$$

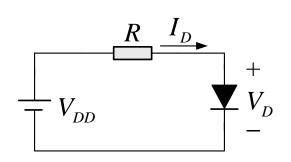
负载稳定度 
$$\frac{\Delta V_o}{\Delta I_L}$$

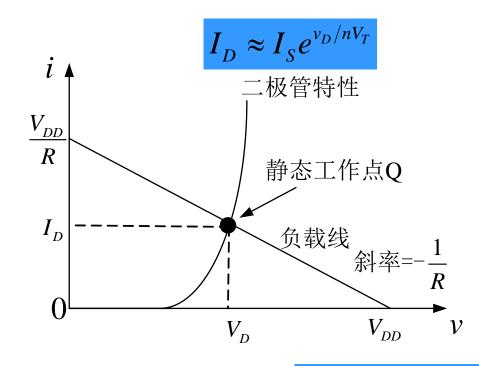
稳压系数 
$$S = \frac{\Delta V_o/V_o}{\Delta V_s/V_s}$$

# 7.2 二极管应用电路的分析

# > 二极管电路分析方法

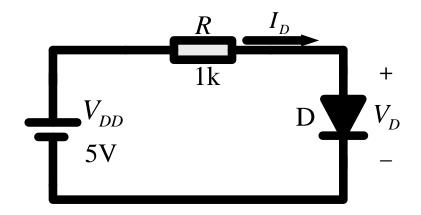
# 1、图解分析法

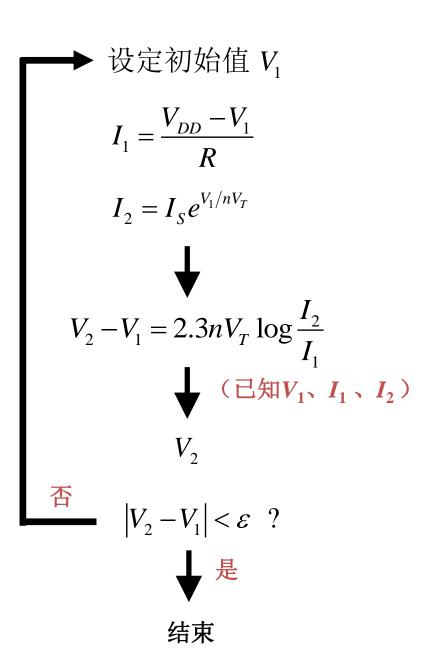




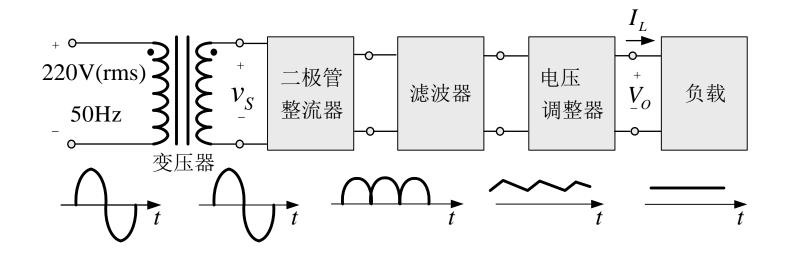
$$V_{DD} = I_D R + V_D$$

#### 2、重复分析法(迭代法)



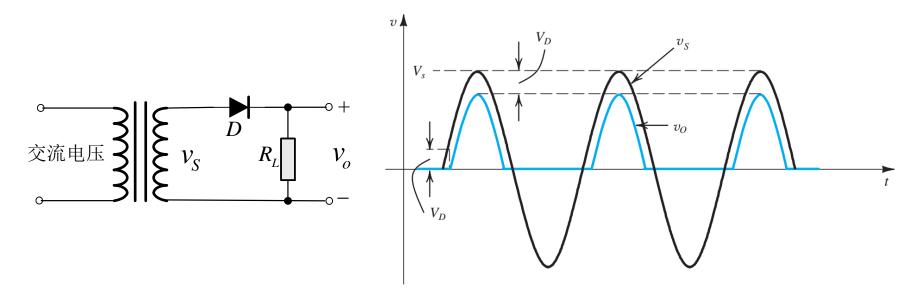


# 7.2.1 整流电路(Rectifiers)



直流稳压电路

#### 一、半波整流器(Half - wave rectifier)

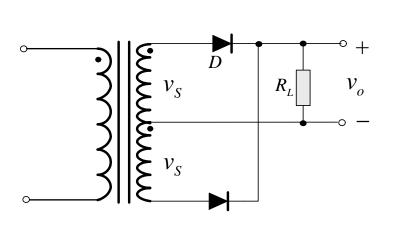


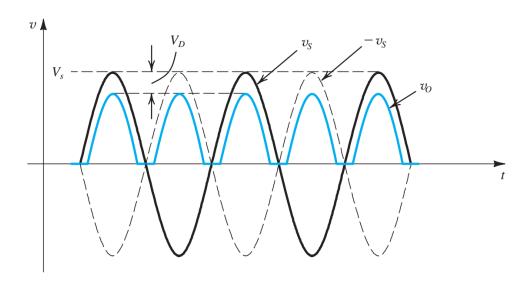
反峰电压 (Peak Inverse Voltage) PIV = Vs



输出直流电压 
$$V_o = \frac{\int_0^\pi \sqrt{2} V_{orms} \sin \phi \mathrm{d}\phi}{2\pi} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} V_{orms} \approx 0.45 V_{orms}$$

#### 二、全波整流器(Full - wave rectifier)

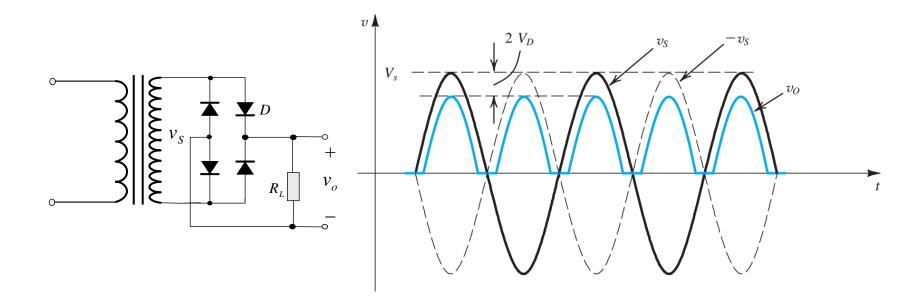




$$PIV = 2V_s - V_D \approx 2V_s$$

输出直流电压 
$$(忽略V_D) \qquad V_o = \frac{\int_0^\pi \sqrt{2} V_{orms} \sin \phi \mathrm{d}\phi}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_{orms} \approx 0.9 V_{orms}$$

# 三、桥式整流器(Bridge rectifier)



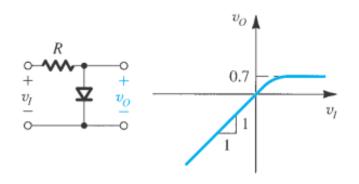
$$PIV = V_{s} - V_{D} \approx V_{s}$$

输出直流电压 
$$V_o = \frac{\int_0^\pi \sqrt{2} V_{orms} \sin \phi d\phi}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_{orms} \approx 0.9 V_{orms}$$

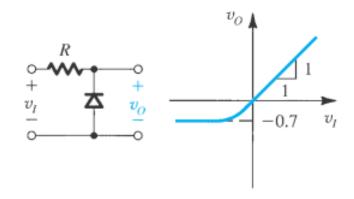
# 7.2.2 限幅和钳位电路

# 一、限幅电路(Limiter Circuit)

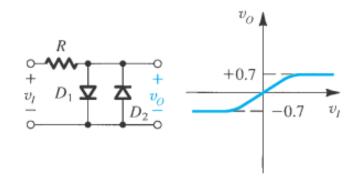
#### 正向限幅电路



#### 反向限幅电路

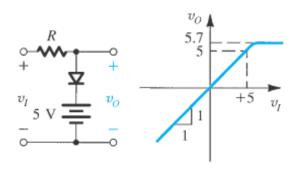


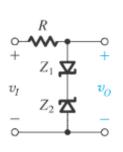
#### 双向限幅电路

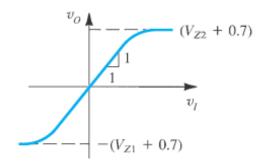


#### 正向限幅电路

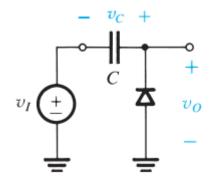
#### 双向限幅电路

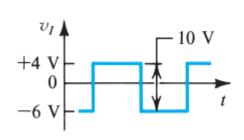






# 二、箝位电路或直流恢复器(Clamped capacitor or DC restorer)

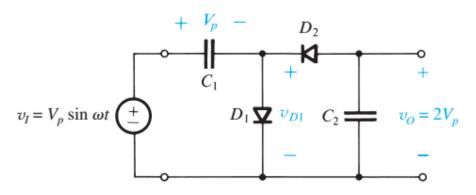


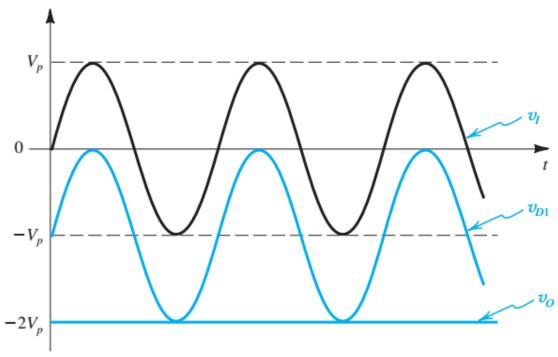




$$v_O = v_I + v_C$$

# 7.2.3 电压倍增器 (Voltage doubler)

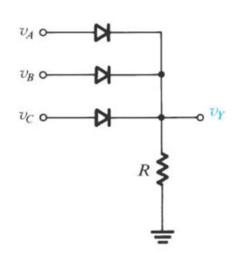




# 7.2.4 逻辑门

# 一、或门

- 高电平表示1, 低电平表示0
- · 若vA、vB、vC中任意一个输入高电平
  - 对应二极管导通
  - ν<sub>γ</sub>输出高电平
- 若所有输入均为低电平
  - 所有二极管截止
  - vy输出低电平



# 二、与门

- 高电平表示1, 低电平表示0
- · 若vA、vB、vC中任意一个输入低电平
  - 对应二极管导通
  - vy输出低电平
- 若所有输入均为高电平
  - 所有二极管截止
  - vy输出高电平

